

EV Group revolutionizes 3D integration from advanced packaging to transistor scaling with NanoCleave™ layer release technology – September 22, 2022

EVG introduced NanoCleave [™], a revolutionary layer release technology for silicon that enables ultra-thin layer stacking for front-end processing, including advanced logic, memory and power device formation, as well as semiconductor advanced packaging. NanoCleave enables silicon wafer carriers in advanced packaging processes such as Fan-out Wafer-level Packaging (FoWLP) using mold and reconstituted wafers as well as interposers for 3D Stacked ICs (3D SIC). EVG's new NanoCleave technology utilizes an IR laser and inorganic release materials to enable laser debonding on silicon with nanometer precision. "NanoCleave will help enable our customers to realize their advanced device and packaging roadmaps through a highly versatile and universal layer release technology that works with standard silicon wafers and wafer processes – enabling seamless integration in the fab and saving our customers both time and money." stated Paul Lindner, executive technology director at EV Group.

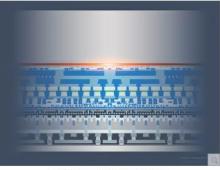




EV 그룹, 첨단 패키징부터 트랜지스터 축소까지 3D 통합 혁신하는 'NanoCleave 레이어 릴리즈' 기술 발표

EVG의 세 적외선(R) 레이저 클리뱅 기술, 실리콘 두파해 나노미터 정밀도의 레이어 이승 실현 첨단 패키징 위한 유리 기만 사용 필요성 제거·박형 레이어 3D 적증 가능

2022-09-22 11:35 술처: EVG



EV 그룹이 NanoCleave 레이어 링리즈 기술을 발표했다

서울~(뉴스와이아) 2022년 08월 22일 ~ MEMS, 나노기술, 반도체 시장용 웨이퍼 본당 및 리소그래피 장비 분야 물 선도하는 EV 그룹(이하 EVG)이 반도체 제초를 위한 혁신적인 레이어 필리즈 기술면 NanoCleave**를 술시한다 고 방향다.

NanoCleave 가슴은 첨단 로젝, 메오리, 전력 반도체 프런트 앤드 공정은 물론, 첨단 반도체 패키징에 초박형 레이 이 작승을 가능하게 한다. NanoCleave는 반도체 전 긍정에 완벽하게 호한되는 레이어 물리츠 가슴도서 실리콘을 투패하는 파장대를 갖는 적외신(IR) 레이저를 사용하는 점이 특징이다. 또한 특수하게 조성된 무기질 레이어가 함 제 사용알 경우 이 가슬은 나노미터의 정말도로 실리콘 처리아로부터 초박형 필름이나 레이어를 IR 레이저로 됩 리즈할 수 있게 한다.

그 결과, NarroCleave는 물당과 제구성 웨이퍼를 사용하는 팬아웃 웨이퍼 리별 패키칭(FoWLPI이나 3D Stacking LC (3D SIG을 위한 인터포져 같은 섬던 패키징 군전에서 실리큰 웨이피 개리아 사용을 가능하게 한다. 고운 군정 에도 적용한 수 있어 3D IC 및 3D 순차 집적 애플리케이션에서 편해 새로운 공정 플로우를 가능하게 한다. 이는 실리콘 개리이 상의 초박법 레이아까지도 하이브리드 및 퓨션 분당이 가능해 3D 및 이중 집작에 책상을 가져다들 뿐만 아니라 차세대 브랜지스터 집적할 실계에서 필요한 레이어 이승(Jayer transfer)을 가능하게 한다.

○ 3D 적층 및 후공정에서 실리콘 캐리아의 이전

3D 집적에서는 전차 높아지는 인터커넥션 대역폭으로 보다 고상능의 시스탑을 구현하도록 박형 웨이퍼 공장을 위한 캐리아 기술이 중요한다. 이를 위해 기존의 주류 기법은 유리 캐리어를 사용하고 있다. 이 기법은 유기 협락 제를 것고 입사 문당을 해서 디바이스 레이어를 향상한 다음, 자신선(MV) 파랑 레이저트 정치재를 올해하고, 디바 이스 레이어를 윌리스한 후 최종 원상품 웨이퍼 상에 영구적으로 본당한다. 하지만 유리 기반은 실리콘 위주로 설 제된 빈도제 제초 장비를 사용해서 처리하기가 까다롭고, 유리 웨이퍼를 처리한 수 있도록 입그레이드를 허려면 비용이 많이 든다. 유기질 접착제는 동상적으로 300°C 이하의 처리 온도로 제한되므로, 후공장에 사용하기에도 한계가 있다.

NanoCleave 기술은 무가 퀄리즈 레이이를 이용해서 실리콘 캐리어를 사용할 수 있어 이런 운도 한제와 유리 캐 리아의 호환성 이슈를 피한 수 있다. R 레이저를 사용해서 나노미터 정말도로 클리뱅을 할 수 있어 가존 긍정을 생경하지 않고, 초박형 디바이스 웨이퍼를 처리할 수 있다. 이렇게 만들어진 초박형 디바이스 레이이를 적용하면 더 높은 대역복위 인터카에트를 구현할 수 있으며, 차시대 고성능 시스템을 위한 다이를 설레 및 시문화하기 위한 세 기회를 만들 수 있다. ◇ 차세대 트렌지스터 노트에 요구되는 새로운 레이어 이송 프로세스

트렌지스터 로드컵이 3nm 이하 노트로 진화하면서 매월형 전원 레일, 후면 전원 공급 네트워크, 상보상 FET (CFET), 2D 원자 채널 같은 새로운 아키역처와 실계 혁신이 필요하였다. 이런 모든 기법에는 극히 잃은 소재의 레 이어 이승이 요구된다. 실러콘 카리아와 무기 퀄리츠 레이아는 전 공정 제조 플로우를 위한 프로세스 청결성, 소 제 호한상, 높은 처리 온도 요건을 지원한다. 하지만 지금까지는 실리콘 캐리아는 그라인딩, 연마, 식각 공정을 거 처서 완벽하게 제거점야 한다. 이는 작업 중인 디바이스 레이이의 표면에 마이크를 대의 차이를 유받하기 때문에 첨단 트렌지스터 노트의 박형 레이어 적중에 사용하기에는 적합하지 없다.

EVE의 새로운 NanoCleave 기술은 IR 레이저와 무가질 릴리즈 소재를 사용하므로 실리콘 상에서 나노미터 정말 도로 레이저 디본딩이 가능하다. 이는 첨단 패키징 긍정에서 유리 기반을 사용한 필요가 없게 해 온도 한계와 유 리 카리이 호한신 문제를 피할 수 있게 한다. 기존 공장을 변경하지 않고도 전 긍정에서 캐리어를 통해 초박형(한 자릿수 마이크론 대 이하) 레이어도 이승할 수 있다. 이런 나노미터 대의 정말도를 지원하는 EVE의 새 프로세스는 더 없은, 디바이스 레이어와 패키지가 필요한 첨단 빈도쳐 디바이스 로드림의 모구를 충족하고, 항상된 이중 침적 을 가능하게 한다. 박형 레이어 이승 및 유리 기반을 사용한 필요가 없어 공정 비용을 줄이도록 한다.

EV Group의 기술 이사인 둘 린드너(Paul Lindner)는 "반도체 긍정 노드를 축소하기가 갈수록 너 복잡하고 어려워 지고 있다. 긍정 노드를 축소하려면 프로세스 허용공차 또한 전차 줄기 때문이다. 업계에서는 더 높은 집적도와 더 높은 디바이스 성능을 달성하기 위한 새로운 프로세스가 집적 방법이 필요하다"며 "우리의 NanoCleave 레이 이 릴리즈 기술은 박형 레이어와 다이 적증을 통한 반도체 리기 축소 분야에서 개인 체인체가 될 것이다. 반도체 업계에서 가장 압박이 신한 요구 사항들을 해결할 잠재력을 갖고 있다"고 말했다.

이어 "NanoCleave는 표준 실리큰 웨이퍼 및 웨이퍼 긍정들과 호한되는 유연하고 범용성이 뛰어난 레이어 릴리즈 기술을 통해 우리 고객들이 첨단 디바이스 및 패키징 로드램을 실현할 수 있게 지원할 것"이라며 "고객들은 이 기 술을 자신들의 기존 팬에 지체없이 통합하고 시간과 비용을 줄일 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

◇ 차별화된 IR 레이저 기술

EVG의 NanoCleave 기술은 실리콘 웨이퍼 뒷면을 IR 레이저에 노출한다. 이 레이저는 실리콘을 두파하는 고유의 파장을 사용한다. 표준 증착 공정을 통해 실리콘 스택에 미리 구축된 무가질 퀄리즈 레이이가 이 IR 강을 흡수하 고, 사선에 정말하게 치정된 레이아나 면적으로 실리콘을 분리한다. 무가질 퀄리즈 레이이를 사용할으로써 중더 정말하고, 얇은 레이이를 사용할 수 있다(유가 집착체를 사용할 때 수 마이크론 대였던 것에 비해 수 나노미터 대 로 많아짐: -무가질 퀄리즈 레이어는 고온 공정(히역 1000°C)과 호한할 수 있어 예퍼택시, 증복, 어닐링 같이 유기 집착체를 사용할 수 없는 많은 새로운 전 공정 애플리케이션들로 레이어 이승을 가능하게 한다.

◇ 제품 공급

EVG의 NanoCleave 레이어 릴리즈 기술은 현재 EVG 본사에서 테모가 가능하다.

http://press.metroseoul.co.kr/newsRead.php?no=951813